発信人 日本国特許庁(国際調査機関)		74.8.04					
出願人代理人	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
清水 初志	•	文门					
様しあて名							
〒 300-0847 日本国茨城県土浦市卸町1-1-1 関鉄つ		PCT 国際調査機関の見解書 (法施行規則第40条の2) [PCT規則43の2.1]					
くばビル6階 清水橋本国際特許事務所	発送日 (日. 月. 年)	03.8.2004					
出願人又は代理人 の書類記号 KRB-A0301P	今後の手続きにつ	ついては、下記2を参照すること。					
国際出願番号 PCT/JP2004/008553 国際出願日 (日.月.年) 11.	06.2004	優先日 (日.月.年) 16.06.2003					
国際特許分類(IPC)							
Int. Cl' G01N33/543, G01N15	/02, G01N1	5/12					
出願人(氏名又は名称) 軽部	征夫						
1. この見解書は次の内容を含む。							
3. さらなる詳細は、様式PCT/ISA/220の備考を参	照すること。						
見解書を作成した日							

見解書を作成した日 16.07.2004				
名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/JP)	特許庁審査官(権限のある職員) 山村 祥子	•	2 Ј	9217
郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101	内約	<b>)</b> 3	3 2 5 1

第 I欄 見解の基礎								
1. この見解書は、7	記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎として作成された。							
□ この見解書は それは国際調	、 語による翻訳文を基礎として作成した。 査のために提出されたPCT規則12.3及び23.1(b)にいう翻訳文の言語である。							
2. この国際出願で開示されかつ請求の範囲に係る発明に不可欠なヌクレオチド又はアミノ酸配列に関して、 以下に基づき見解書を作成した。								
a. タイプ	配列表							
	■ 配列表に関連するテーブル							
b. フォーマット	<b>事面</b>							
	コンピュータ読み取り可能な形式							
c. 提出時期	出願時の国際出願に含まれる							
·	この国際出願と共にコンピュータ読み取り可能な形式により提出された							
	出願後に、調査のために、この国際調査機関に提出された							
	表又は配列表に関連するテーブルを提出した場合に、出願後に提出した配列若しくは追加して提出し  時に提出した配列と同一である旨、又は、出願時の開示を超える事項を含まない旨の陳述書の提出が 							
4. 補足意見:								
180								
i								

	規性、進歩性又は産業上の れを裏付る文献及び説明	)利用可能性についての 	OPCT規則43の2.1(a)(i)に定める見解、 	
1. 見解				
新規性	(N)	請求の範囲 請求の範囲	1-16	- 有 - 無
	•			

 進歩性 (IS)
 請求の範囲
 9,15,16
 有

 請求の範囲
 1-8,10-14
 無

 産業上の利用可能性(IA)
 請求の範囲
 1-16
 無

 無
 無
 無

## 2. 文献及び説明

文献 1: JP 07-083928 A (軽部征夫) 1995.03.31

文献 2: JP 01-259257 A (東亜医用電子株式会社) 1989.10.16

& US 5215714 A & EP 336013 A

文献 3: JP 07-128217 A(東亜医用電子株式会社) 1995.05.19

& US 5506673 A & EP 652428 A

請求の範囲1-8、10-14について

文献1には、担体粒子を使用する免疫学的凝集反応を用いた親和性物質の測定方法において、反応系に電圧パルスを印可し、担体粒子パールチェイン化し、その後電場を停止し、CCDカメラで担体の凝集状態を測定する方法が記載されている。

文献1には、測定の際に、担体粒子の三次元情報を指標として計測する構成は記載されていない。

文献2には、フローセルを使用し、前記セルにレーザ光を照射し粒子個々の散乱 光から粒子計数の計測を行い、粒度分布を得、凝集度を測定する構成の免疫凝集測 定装置が記載されている。

文献3には、フローセルを使用し、電気抵抗及び散乱光の測定値を使用して粒径、球形度または凝集度合いを測定する粒子分析装置が記載されており、また、クールター法、レーザー回折散乱光による粒子測定装置が従来例として記載されている。

引例1記載の方法における測定の際に、文献2,3の担体の三次元情報を測定する装置を使用することは、当業者であれば容易に想到し得たものである。

また、電場を停止後に更に付加的に希釈を行うこと、電圧パルスを複数回与えることは、当業者が必要に応じて適宜なし得る事項である。

(続葉あり)

## 補充欄

いずれかの欄の大きさが足りない場合

第 V.2. 欄の続き

請求の範囲9, 15, 16について

複数回の異なる方向の電圧パルスを与えること、及び、少なくとも2組の電圧パルスを印可させるための電極を有する装置は、国際調査報告で列記した文献のいずれにも記載されておらず、当業者にとって自明なものでもない。

(続葉なし)